

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 馬渡宏泰 副委員長 弓削哲史

幹事 安里 彰・岡村寛之 幹事補佐 マラット ザニケエフ・田村信幸

日時 11月17日(木) 14:00~16:20

会場 大阪中央電気倶楽部(大阪市北区堂島浜2-1-25. 大阪駅より徒歩12分, JR北新地駅より7分, 地下鉄四つ橋

線:西梅田駅より6分ほか. <http://www.chuodenki-club.or.jp/> TEL [06] 6345-6351 柳井健太郎(オムロン)

議題 半導体と電子デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. 離散化モデルによるワイブル分布の3-パラメータ推定 魚岸健次
2. 機械学習を用いたソフトウェアの信頼性解析 貝瀬 徹(兵庫県立大)
3. 最尤推定法を使った製造条件範囲の最適化 松岡敏成(三菱電機)
4. はんだ実装基板におけるエレクトロケミカルマイグレーションテストー考察 伊藤貞則(イトケン)
5. X線透視観察装置における高白黒階調性能の効果について 芝野照夫(三菱電機)

◆日本信頼性学会関西支部, IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催

☆R研究会今後の予定 []内発表申込締切日

12月16日(金) マホロバマインズ三浦〔締切済〕テーマ:信頼性国際規格, 保全性, 信頼性一般

【問合先】

岡村寛之(広島大)

E-mail: okamu@rel.hiroshima-u.ac.jp